

平成 28 年 9 月 28 日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 田島 道夫

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会
第 150 回研究会 開催通知

日時： 2016 年 10 月 21 日 (金), 13:00~

会場： 明治大学駿河台キャンパス 大学会館 3 階 第 1・2 会議室

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

東京都千代田区神田駿河台 1-1 (TEL: 03-3296-4545 明治大学総合案内)

交通： JR 中央線・総武線, 東京メトロ丸の内線/御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分

東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩 5 分

都営地下鉄三田線・新宿線, 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩 5 分

テーマ：バルクライフタイム測定を中心とする欠陥・評価関係

世話人：金田 寛 (九州工業大学), 村上 進 (茨城大学), 泉妻 宏治 (グローバルウェーブズ・ジャパン), 佐俣 秀一 (SUMCO)

プログラム：

- | | | | | |
|------|-------------|---|----------------------|--------------------|
| (1) | 13:00-13:05 | 開会の挨拶 | 明治大学 | 田島 道夫 |
| (2) | 13:05-13:10 | はじめに | 九州工業大学 | 金田 寛 |
| (3) | 13:10-13:45 | 「 μ -PCD 法によるキャリアライフタイムの測定とその応用」 | コベルコ科研 | 綱木 英俊, 他 |
| (4) | 13:45-14:20 | 高抵抗 CZ-Si ウェーハのライフタイム測定における HF 処理表面の影響 | グローバルウェーブズ・ジャパン | 荒木 延恵, 他 |
| (5) | 14:20-14:55 | Digital-SPV によるシリコンウェーハの高感度金属汚染モニター | 日本セミラボ | Nguyen Viet Nguyen |
| | 14:55-15:15 | 休憩 | | |
| (6) | 15:15-15:50 | DLTS 法によるトラップ準位の評価ー Si から SiC, GaN, 新材料への応用 | Phystech/セラミックフォーラム | Ludwig COHAUSZ |
| (7) | 15:50-16:25 | Superjunction MOS における欠陥・ライフタイムの特性影響 | 東芝 ストレージ&デバイスソリューション | 齋藤 渉 |
| (8) | 16:25-17:00 | 金属不純物等の CMOS イメージセンサの性能への影響 | キヤノン | 佐藤信彦 |
| (9) | 17:00-17:20 | 全体討論：共通理解を求めて。(進行役)九州工業大学 | | 金田 寛 |
| (10) | 17:20-17:25 | おわりに | 茨城大学 | 村上 進 |
| | 17:30-20:00 | 意見交換会 | (於) サロン燦 | |